

*Anna Dorota Potocka*  
(Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)  
*Aleksandra Rzeszutek*  
(Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

99

## **Problematyka deformacji portretów z kolekcji Tyszkiewiczów z Łohojska jako przyczynek do badań nad malarstwem staropolskim z końca XVIII wieku**

Kolekcję portretów rodowych Tyszkiewiczów z Łohojska z końca XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie stanowi zespół kilkudziesięciu obrazów, które w wyniku burzliwych dziejów całej kolekcji, uległy specyficznym, niecharakterystycznym zniszczeniom strukturalnym. Badania naukowe prowadzone na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie dotyczące wizerunków Michała Tyszkiewicza hetmana polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Michała Tyszkiewicza starosty strzałkowskiego i Leona Tyszkiewicza, kasztelana lubelskiego, stały się kanwą do prac naukowych nad malarstwem staropolskim pochodzącym z terenów dawnej Litwy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nietypowych i niejasnych powodów ich deformacji.

Podstawowym problemem badawczym projektu było ustalenie przyczyny powstania rozległych zniszczeń podłoża portretów, które nadały płaszczyznom obrazów na płótnie formę zbliżoną do płaskorzeźby. Uwypuklenia sięgające nawet do kilku milimetrów szczególnie silnie widoczne w partiach malarskich karnacji oraz elementów strojów sportretowanych, w dużym stopniu zmieniły ich charakter i nadały wizerunkom niespotykaną, odmienną od pierwotnej, formę wyrazu. Od strony odwroci deformacje utrwalone w analogiczny sposób tworzyły wklęsłe sylwetki wyobrażonych członków rodu.

Odczytanie i identyfikacja genezy tak rozległych odkształceń obrazów sztalugowych okazały się procesem bardzo złożonym i skomplikowanym. Dzięki zastosowaniu szerokiego spektrum badań uzyskano wyniki pozwalające na wstępną identyfikację przyczyn oraz miarodajną ocenę skutków nietypowych procesów starzenia materii obrazów.

W ramach podjętych badań wykonano szereg analiz mikrokrystaloskopowych i specjalistycznych pigmentów oraz spoiw użytych w proce-

nie twórczym, w tym fluorescencją rentgenowską (XRF), spektrofotometrię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), chromatografię gazową ze spektrometrią mas (GC-MS) oraz badania z użyciem elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM).

Pogłębiona analiza techniki oraz technologii wykonania obrazów w kontekście wpływu wtórnych interwencji na ich stan zachowania, poparta rozbudowaną kwerendą archiwalną i badawczą, pozwoliła na identyfikację nie wyjaśnionych do tej pory fizykochemicznych powodów ich deformacji.